



# Leica Stereo Explorer

Modulo per superfici

*Leica*  
MICROSYSTEMS

## Descrizione:

Il modulo per superfici Stereo Explorer permette la valutazione della superficie relativamente a parametri quali ruvidità e ondulazione. La dimensione frattale è un valore dall'analisi frazionaria per descrivere la superficie e viene calcolata con lo Stereo Explorer per superfici. Un ulteriore parametro per la valutazione della superficie è il rapporto tra la superficie vera e quella proiettata. Per la definizione di una ROI (region of interest) l'utente può scegliere tra le modalità rettangolo e poligono.

Con la ROI viene selezionata la parte dell'immagine per la quale si desiderano calcolare i parametri della superficie. La rappresentazione della superficie avviene o con l'immagine originaria dello stereomicroscopio o con un'immagine a colori o a toni di grigio codificata in altezza. Similmente ad una cartina geografica, è possibile anche sovrapporre le linee altimetriche delle sezioni. La rappresentazione corrente può essere salvata sotto forma di immagine (JPG, TIFF, PNG, BMP...) e stampata.

## Funzioni principali:

- Poligono o rettangolo liberamente selezionabile
- Misurazione della superficie vera e di quella proiettata
- Estrazione di parametri come ondulazione e ruvidità
- Funzione di esportazione di tutti i dati misurati sotto forma di immagine o tabella
- Possibilità di fissare e modificare il livello di riferimento
- Rappresentazione dell'immagine da misurare sotto forma di immagine altimetrica o, alternativamente, anaglifica
- Sovrapposizione delle quote altimetriche delle sezioni

Numero di ordinazione

**33 007 036**

Modulo per superfici Leica Stereo Explorer

Leica Microsystems  
Viale Ortles, 54/A  
IT-20139 Milano

Tel. +39 02 57 486.1  
Fax +39 02 57 40 3273  
[www.leica-microsystems.com](http://www.leica-microsystems.com)  
[www.stereomicroscopy.com](http://www.stereomicroscopy.com)

**Leica**  
MICROSYSTEMS